形態観察　元素分析（定性・定量）　鮮明な高倍率観察と詳細な元素マッピングが可能

電界放出型電子プローブマイクロアナライザ （FE－EPMA）

機種名

製造　：　日本電子株式会社
型式　：　JXA－8500F
設置　：　2005年 3月

特　徴

従来のEPMAと比べて、鮮明な高倍率観察と詳細な元素マッピングが可能です。

図1：SEM像の比較

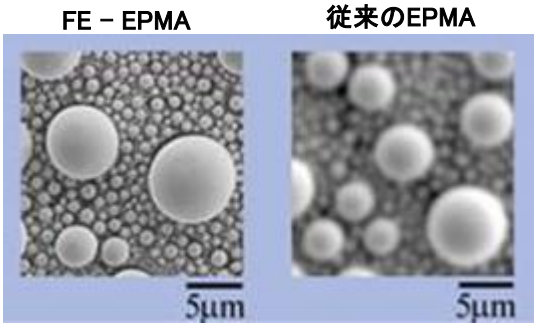
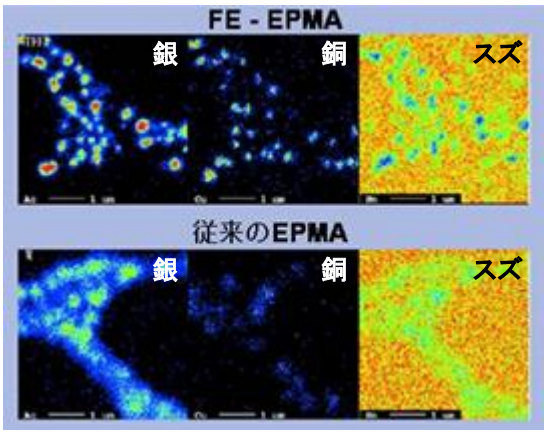


図2：元素マッピングの比較



（日本電子株式会社パンフレットより）

【サンプルについて】
・導電性を有すること
・導電性の悪いサンプルには、導電性コーティングを行う
・寸法上限：φ36mm×h 20mm 等
　このほか、真空中への投入や電子ビーム照射による揮発成分があるもの、変形するもの等は不適です。

【主な仕様】
○実用観察倍率：　40 ～ 20,000 倍程度
○電界放出型（ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯｼｮﾝ：FE）電子銃
○加速電圧：　1 kV ～ 30 kV
○分析元素：　5 B ～ 92 U
○OS：　Windows XP

【データ出力】
○記録メディア　USB
○保存形式　画像（BMP他）、テキスト形式

料金等

○機器使用　　4,800 円 ／ 時
○操作説明　　11,700 円（3時間の場合）
○分析依頼
　定性　　8,500 円 ／ 件
　マッピング　　3,400 円 ／ 元素

研究員による支援　3,900 円 ／ 時

○定量分析　　標準サンプルを用いると数%の精度で元素の定量ができます。詳細は、ご相談下さい。

○試料前処理の支援　　サンプルを観察および分析可能とするための処理をお手伝いします。

ご利用申し込みは実施日の3日前まで可能です。

2019.10　改訂